

Contents

| | |
|--|----|
| RAFALOWSKI M., Wave-aberration of an optical system with small decentrations. Vector approach | 3 |
| JÓŻWICKI R., Fresnel field of a multiple diffraction grating system illuminated by a point source | 13 |
| КОПЕЦ G. J., Thickness of the layers of multilayer nonquarterwave interference filters controlled by direct level monitoring | 33 |
| BIENIAK B., FILIPOWICZ P., GŁÓDŹ M., JASTRZĘBSKI W., SZONERT J., WITWICKI T., Micro-computer-assisted spectrum analyzer with thermionic diode detector | 39 |
| PLUTA M., Variable wavelength interferometry. V. Application to birefringent objects | 47 |
| Book reviews | 65 |

Содержание

| | |
|---|----|
| РАФАЛОВСКИ М., Волновая aberrация оптических систем с малыми децентрировками. Векторный анализ | 3 |
| Юзьвицки Р., Область Френеля для системы дифракционных решеток освещенной точечным источником | 13 |
| КОПЕЦ Г. Й., Определение толщины слоев фильтров с нечетвертьволновыми оптическими толщинами при использовании фотометрического способа контроля нанесения слоев | 33 |
| БЕНЯК Б., Филипович П., Глудзь М., Ястжемьски М., Шонэрт Й., Витвицки Т., Анализатор спектра с детектировочным диодом управляемый микрокомпьютером | 39 |
| Плюта М., Интерферометрия с плавно-переменной длиной волны. V. Применение для двоякопереломляющих предметов | 47 |
| Рецензии книг | 65 |